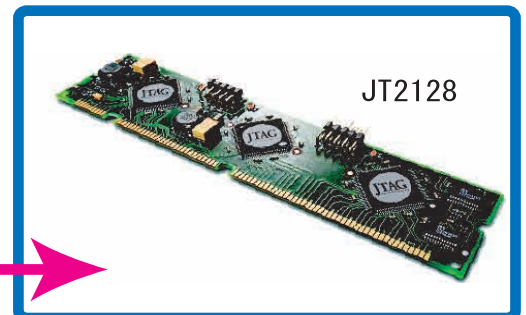
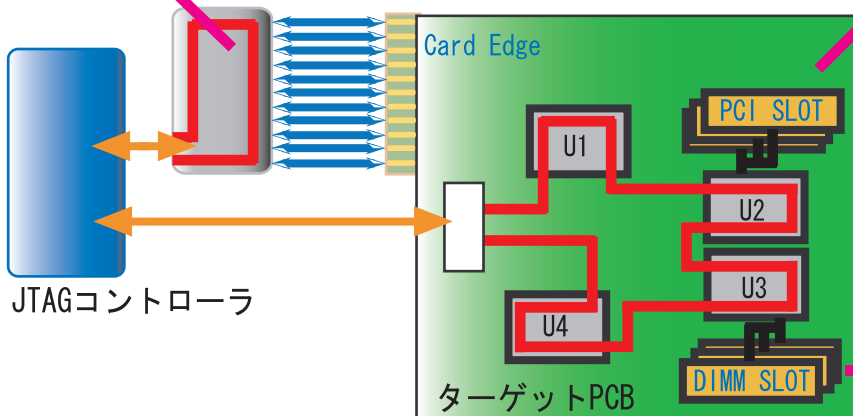
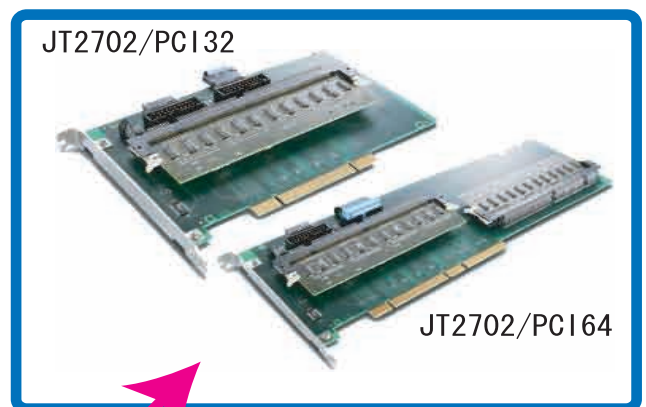
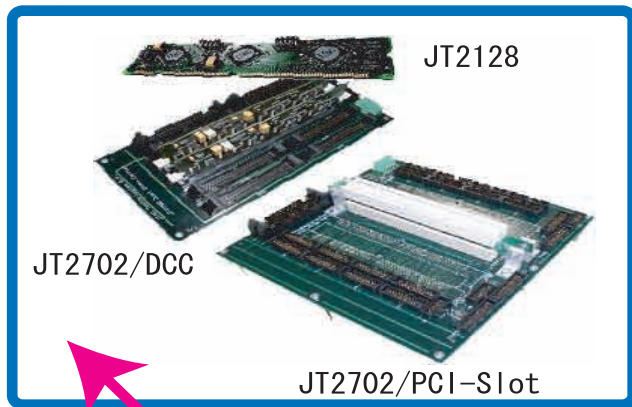


バウンダリスキャン・テストの効率を上げる豊富なアクセサリ パラレル デジタル I/O テストアクセス製品

バウンダリスキャン・テストの範囲を広げるためには、パラレル・デジタルI/Oアクセサリの使用が効果的です。JTAG Technologies社製品ではコネクタ、DIMMソケット、PCIスロットなどのテストを行うのに最適なDIOS(Digital I/O Scan module)をご用意しております。



機能

- PCIバス, DIMM, コネクタ部分のJTAGテストが可能
- 3.3Vおよび5VのPCIバスに対応 (JT3702 PCIバス用DIOS)
- PCIバスの任意のピンへ外部電源の割付が可能 (JT2702/PCI-Slot)
- テストピンによって電源消費がモニタリング可能 (JT2702/PCI-Slot)
- コネクタ、カードエッジ、テストピンへの柔軟なピン割付が可能

製品名

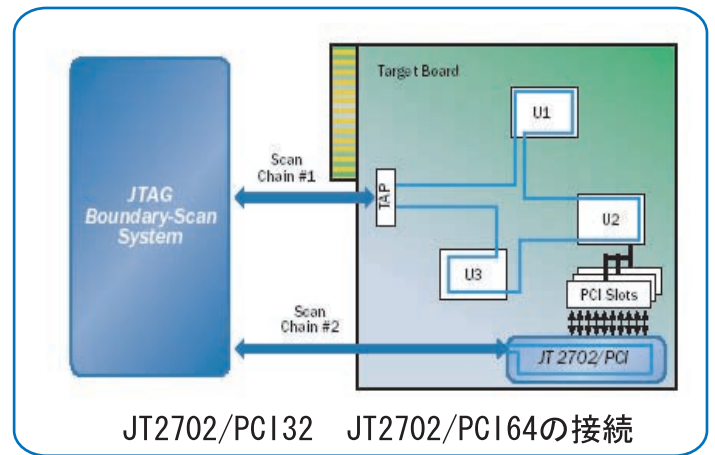
- JT3702/PCI32 : 32bit PCIバス用
- JT3702/PCI64 : 64bit PCIバス用
- JT2702/PCI-Slot : 32/64bit PCIスロット用
- JT2702/DDC : DIMMキャリア・モジュール
- JT2122/(F)168 : 128bit(F:133bit) I/O DIMMモジュール ※TAP電圧 3.3V/5V
- JT2124/(F)168 : 128bit(F:133bit) I/O DIMMモジュール ※TAP電圧 可変
- JT2128/v168 : 128bit I/O DIMMモジュール ※TAP電圧 可変
※v部分にはAかBのいずれかが入ります。A: 2.5 - 3.3 - 5V, B: 1.8 - 2.5 - 3.3V
- PF2111/LV : 64bit I/Oモジュール

●JT2702/PCI32およびJT2702/PCI64

JT2702/PCI32およびJT2702/PCI64は、3.3Vと5Vバージョンのマザーボードやバックプレーン上のPCIスロットをバウンダリスキャン・テストするためのユニバーサル・プラグイン・カードです。32bitおよび64bitバスごとに製品をご用意しています。

右図のように、ターゲット・システム上のPCIスロットに装着して使用する製品です。

※TAP信号はPCIスロット上に配置されています。

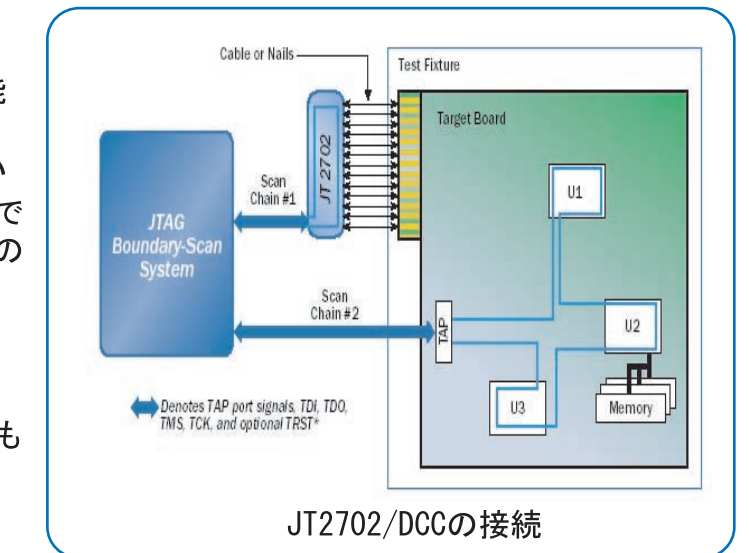
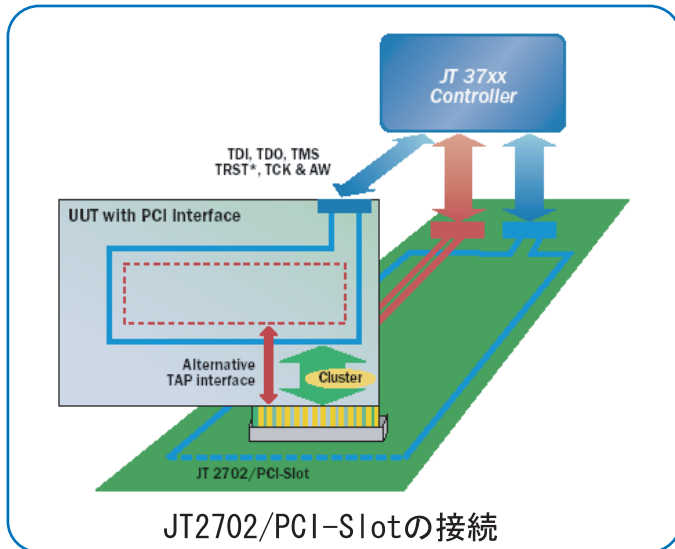


●JT2702/PCI-Slot

JT2702/PCI-Slotは、PCIカード・インターフェイスを持つプラグイン・カードをテストするためのPCIユニバーサル・テスト・ボードです。

32bitおよび64bitのPCIバス(3.3Vと5Vバージョン)をテストすることが可能です。

左図のように、ターゲット基板を装着して使用する製品です。



●JT2702/DCC

JT2702/DCCは、JT212x DIMM DIOSを2枚装着可能なDIMMのキャリアです。

本製品にはI/O接続用のコネクタが搭載されていますので、ケーブルやピン治具を製作することでターゲット基板のコネクタやカードエッジなどのインターフェイス部分をテストすることが可能です。

本製品1セットで最大256bitのI/Oをテストすることができます。

また、TAP入力コネクタの他にTAP出力コネクタも搭載していますので、本製品をシリアルに複数セット接続することができます。

●JT212x DIMM DIOS

JT212xシリーズは、JT2122/(F)168、JT2124/(F)168、JT2128はターゲット基板のDIMMスロットがテスト可能な製品です。JT2702/DCCと併用することでターゲット基板のコネクタやカードエッジなどの各種I/Oがテスト可能な汎用性のある製品です。



JTAG Technologies社 日本総代理店

アンドールシステムサポート株式会社

エンベデッドソリューションズ 事業部 JTAGソリューションセンター

〒140-0004 東京都品川区南品川2-15-8

TEL : 03-3450-7201 FAX : 03-3450-8109

URL: <http://www.andor.jp> E-mail: jtag@andor.jp